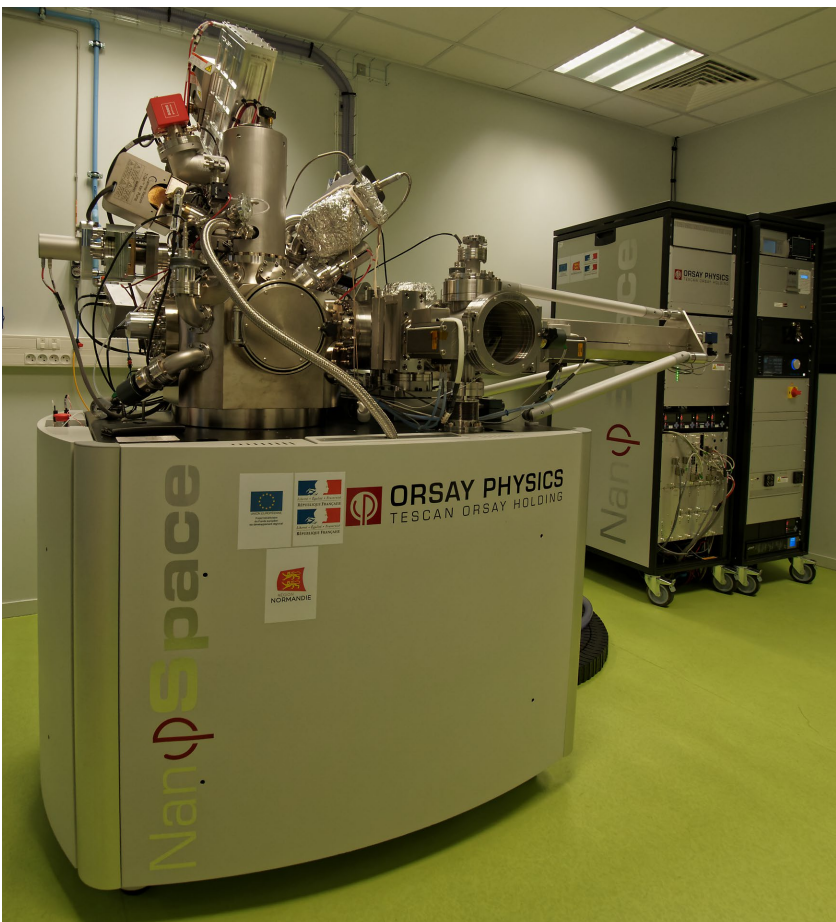




UNIVERSITÉ
CAEN
NORMANDIE

PROSIMS

Profilage chimique et isotopique en profondeur par TOF-SIMS.



Spectromètre de masse à ionisation secondaires en temps de vol [Time-of-flight secondary ion mass spectrometry (TOF-SIMS)] permettant d'effectuer des profils de composition en fonction de la profondeur avec une résolution nanométrique. Il permet l'analyse de matériaux très sensibles, bien établie pour de nombreuses applications industrielles et de recherche. Il fournit des informations élémentaires et moléculaires détaillées sur les surfaces, les couches minces, les interfaces et une analyse tridimensionnelle complète des échantillons de type varié (semi-conducteurs, polymères, peinture, revêtements, verre, papier, métaux, céramique, biomatériaux, produits pharmaceutiques).

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne et la Région Normandie.



RÉGION
NORMANDIE



UNION EUROPÉENNE

Fonds européen
de développement régional



ÉCOLE PUBLIQUE D'INGÉNIEURS
CENTRE DE RECHERCHE



RÉGION
NORMANDIE



UNION EUROPÉENNE